### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-197225

(43) Date of publication of application: 31.07.1998

(51)Int.CI.

G01B 11/24

G06T 7/00

(21)Application number: **09-003892** (71)Applicant: **NEC CORP** 

(22)Date of filing: 13.01.1997

(72)Inventor: KAWAI SHIGERU

(54) SHAPE MEASURING INSTRUMENT FOR THREE-DIMENSIONAL OBJECT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shape measuring instrument for threedimensional object which has a simple constitution and takes a safety measure. SOLUTION: A light beam emitted from a light source 1 is two-dimensionally scanned with a two-dimensional scanner 3 after collimation by means of a collimating lens 2 and forms a striped pattern on an object 5 through an  $f.\theta$  lens 4. The striped pattern 5 formed on the object 5 is observed with a TV camera 10 and transferred to a picture processor 11. Standard stripped patterns corresponding to various striped patterns are inputted to the picture processor 11 and the processor 11 extracts the Moire fringe between the standard pattern corresponding to the striped pattern formed on the object 5 and the deformed stripped pattern actually formed on the surface of the object 5. The contour lines on the surface of the object 5 can be found by analyzing the Moire fringe by means of an arithmetic and control unit 9. Moreover, the three-dimensional shape of an object having a step-like

shape or an arbitrary size can be measured easily by forming at least two striped patterns having different directions and pitches on the surface of the object.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.01.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2939944

[Date of registration]

18.06.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

# 特開平10-197225

(43)公開日 平成10年(1998) 7月31日

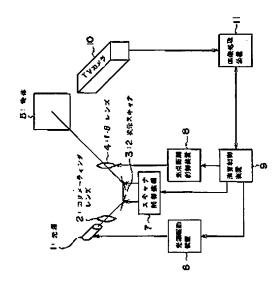
(51) Int.CL <sup>6</sup>	織別盆号	PI	,	
G01B 11/2		G01B 11/24	K	
-			E	
G06T 7/6	0	G06F 15/62	416	
		容型 前求有 一 第:	<b>求項の数4 OL (全 5 頁)</b>	
(21)出職番号	<b>特顧平9−3892</b>	(71)出廢人 000004237 日本電気株式会社		
(22)出驗日	平成9年(1997)1月13日	東京都港区芝五丁目7番1号		
		(72)発明者 河合 滋		
		東京都港区 式会社内	艺五丁目7番1号 日本電気株	
		(74)代理人 弁理士 後	藤 芹介 (外2名)	
		·		

#### (54) 【発明の名称】 3次元物体形状計劃装置

## (57)【要約】

【課題】 構成が簡易で、安全面を考慮に入れた3次元 物体形状計測装置を提供する。

【解決手段】 光源1から出射された光ビームは、コリ メーティングレンズ2でコリメートされた後、2次元ス キャナ3によって2次元的に走査され、 $1 \cdot \theta$ レンズ4 によって物体5上に縞模様を描画する。物体5面上にで きた縞模様は、TVカメラ10によって観測され、画像 処理装置11に転送される。画像処理装置11には、そ れぞれの縞模様に対応する基準の縞状パタンが入力され ており、物体面で変形した縞模様との間のモアレ縞を抽 出する。このモアレ縞を演算制御装置9によって解析す ることによって、物体5の表面の等高線を求めることが できる。方向とピッチの異なる縞模様を少なくとも2 回、物体に描画することによって、階段状の物体や任意 の大きさの物体の3次元形状を容易に計測する。



(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光瀬と、前記光源から出射した光ピーム を2次元的に走査する走査手段と、前記走査手段によっ て走査された光を集光するためのビーム集光手段と、物 体を操像するための鏝像手段と、前記操像手段によって 緑像された画像を格納するための画像メモリを含み、画 像間の処理を行う画像処理手段と、を有することを特徴 とする3次元物体形状計測装置。

【請求項2】 前記走査手段がガルバノミラーである、 請求項1に記載の3次元物体形状計測装置。

【請求項3】 前記光源から出射される光の波長が、 1. 55 µ m ± 0. 1 µ m であることを特徴とする請求 項1に記載の3次元物体形状計測装置。

【請求項4】 前記ピーム集光手段が、焦点距離可変の レンズから模成されている語求項1に記載の3次元物体 形状計測裝置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は形状計測装置に関 し、特に、モアレトボグラフィに代表されるような、縞 20 形状を測定できる。 を利用した3次元物体形状計測装置に関する。

100021

【従来の技術】周知のように、モアレトポグラフィと は、物体面上に縞状パタンを投射し、物体の形状により 変形した縞模様と基準の縞模様とを重ね合わせ、それの 差層波数として生じる等高線を表わすそアレ縞を解析す ることにより、物体の形状を測定する方法である。詳し くは、例えば、雑誌「アプライド・オプティックス(Ao ned Optics )」、9巻、1970年、1667頁~1 4.7.2頁に記載の論文「モアレ・トポグラフィ(Morre Topography)」に述べられている。この方法には、図4 および図5に示す2つの型がある。

【0003】1つは、図4に示すように、物体23の直 前に置いた格子22を点光源21によって照射する格子 照射型である。もう1つは、図5に示すように、格子2 4の像を物体面上に結像させる格子投影型である。両方 法を比較した場合、走査性において、後者の方に柔軟性 があり、応用範囲が広い。格子投影型モアレトポグラフ ィについては、例えば雑誌「アプライド・オプティック 頁~855頁に記載の論文「自動3次元トポグラフィに おける移動格子法を用いたモアレ投影法(Projection q Morie with moving grating for autometed 3-D topog raphy )」に詳しく述べられている。

【0004】上述した従来の3次元物体形状計測方法で は、発生する格子の方向はいつも一定である。ところ が、図2に示すような物体23の形状を計測する場合に は、物体が階段状になっている場所で、等高線モアレ縞 の次数を判断できなくなる。また、投影光学系と操像系 によって、計測できる物体の大きさが決められている。 50 55 µm±0.1 µmであることが好ましい。さらに、

【0005】とれを解決するために、特別昭61-26 ()107号公報(以下、先行技術文献と呼ぶ)には、縞 状パターンを縞の方向を変えて少なくとも2回候測定物 体に投影することにより、階段状の物体においても等高 **複モアレ縞の次数を判断することを可能とした「3次元** 計測方法および続置」が開示されている。この先行技術 文献では、ボログラフィックレーザスキャナの前置光学 系において、走査ビームが物体の面上で走査方向に収 京、副走査方向に発散する様に調整すれば、副走査方向 10 のビーム幅により、走査長として決められた長さを一面 に走査する。この時に、前置光学内部に光空間変調器を 置き、光透過率を()または1にすることにより、縞状の パターンができる。これをスキャナで走査することによ り、物体の面に縞模様を発生することができる。前述し たように、モアレトボグラフィでは格子を用いて階段状 の物体に段差に平行な縞模様を投影すると、段差のある 位置で等高級が不連続となり、次数の判定ができなくな る。しかし方向の異なる縞を少なくとも2回物体に投影 することにより、次数の制定が常に可能となり、物体の

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述した先行技術で は、光源から出射した光ビームを走査して物体面上に縞 模様のパタンを描画するためのスキャナ(走査手段)と して、ホログラフィックレーザスキャナを採用してい る。しかしながら、ホログラフィックレーザスキャナそ れ自体は1次元スキャナであるため、物体面に縞模様を 発生するためには、ボログラフィックレーザスキャナの 前段に1次元光空間変調器を含む前置光学系を設ける必 要がある。従って、構成が複雑になるという欠点があ る。また、光源として使用する半導体レーザとしては、 人間の目に対する安全面を考慮して遵釈するのが好まし Ĺ.

【0007】したがって、本発明の目的は、橏成が簡易 な3次元物体形状計測装置を提供することにある。

【①①①8】本発明の他の目的は、安全面を考慮に入れ た3次元物体形状計測装置を提供することにある。 [00009]

【課題を解決するための手段】本発明の3次元物体形状 ス(Aplied Optics)」、22巻、1983年、850 40 計測装置は、光源と、前記光源から出射した光ビームを 2次元的に走査する走査手段と、前記走査手段によって **定査された光を集光するためのビーム集光手段と、物体** を撮像するための経像手段と、前記操像手段によって繰 像された画像を格納するための画像メモリを含み、画像 間の処理を行う画像処理手段と、を有することを特徴と する。

> 【0010】上記3次元物体形状計測装置において、前 記走査手段としては、例えば、ガルバノミラーを使用で きる。また、前記光源から出射される光の波長は、1.

(3)

前記ピーム集光手段が、焦点距離可変のレンズから構成 されていることが望ましい。

#### [0011]

【作用】ガルバノミラーに代表される2次元スキャナを 用いると、光源から出射した光ビームを2次元的に、自 由に走査することができる。この2次元スキャナを用い て光ブームを走査することによって 物体上に任意のピ ッチと方向とをもった縞模様のパタンを発生(猫画)さ せるととができる。

いて、階段状の物体に図2に示すような方向の縞模様3 ()を投影すると、段差のある位置で等高線が不連続とな り、次数の判定ができなくなる。この際、図3に示すよ うに、段差に平行でない縞31を描画すると、等高線が 連続になるため、次数の判定が可能になる。また、描画 した縞模様のビッチによって、等高線の間隔が決まる。 大きな物体には荒い縞を、小さい物体や複雑な形状をも つ物体には、細かい縞を猫画することが望ましい。測定 前の段階では、段差の有無、段差の方向、物体の大きさ | 荒い縞を、少なくとも2回物体に描画することにより、 それぞれの測定で等高線が不連続となる段差は、他の方 向の測定で段差にならない。また、物体の大きさや、彼 維な構造の有無を知ることもできる。この情報を元に、 縞模様のピッチや方向を変化させ、物体の詳細な形状を 測定することが可能である。

【0013】初めに行なう2回の測定では、第1回目の 測定において、例えば図2の方向の縞を物体に猫画し、 第2回目の測定において、例えば図3のように、第1回 描画することで、一方の測定で不足している情報を、他 方で補うことができる。物体上で変形した縞模様は、画 像メモリ内部の計算機によって作製された仮想の縞模様 と重ね合わせ、画像演算によってノイズのないモアレ縞 を発生させることができる。このモアレ縞を解析して、 物体の形状を認識することができる。

### [0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して詳細に説明する。図1に本発明の一実 施の形態による3次元物体形状測定装置の構成を示す。 40 図示の3次元物体形状測定装置は、光源1と、コリメー ティングレンズ2と、2次元スキャナ3と、1・日レン ズ4と、光源駆動装置6と、スキャナ制御装置7と、焦 点距離制御装置8と、演算制御装置9と、TVカメラ1 ()と、画像処理装置 11とを有する。

【()() 15】光源1は人間の目に対して安全な1.55 um帯の波長の光を発振する半導体レーザからなる。コ リメーティングレンズ2は光源1から出射された光ビー ムをコリメートする。2次元スキャナ3は例えばガルバ ノミラーからなり、コリメーティングレンズ2でコリメー59 回すれば、階段状の物体や大きさを予測できなかった物

ートされた光を2次元的に走査する。f · θ レンズ4 は 焦点距離を変化させることができるレンズであって、2 次元スキャナ3で走査された光を集光して、物体5上に 縞模様を描画する。光源駆動装置6は光源1を駆動し、 スキャナ制御装置7は2次元スキャナ3を制御し、焦点 距離副御装置8は $1 \cdot \theta$ レンズ4の焦点距離を変化させ る。これら光源駆動装置6. スキャナ制御装置?および 焦点距離制御装置8はGP-!B (general purpose in terfacebus ) インタフェイスを有するファンクション 【0012】モアレトボグラフィ法では、格子22を用 10 ジェネレータなどで構成できる。すなわち、光源駆動装 置6は光源1に印加する電圧でよって電源1のオン・オ つを副御し、スキャナ制御装置7は2次元スキャナ3に 印加する電圧によって2次元スキャナ3を制御し、焦点 距離副御装置8は $1 + \theta$ レンズ4に印刻する電圧によっ て焦点距離を可変する。消算制御装置9はたとえばパー ソナルコンピュータで構成され、光源駆動装置6.スキ ャナ制御装置?および焦点距離制御装置8を制御する。 TVカメラ10は物体5上にできた縞模様のパタンを緑 像する。画像処理装置!1はGP-IBなどのインタフ などが不明である。しかしながら、方向の異なる比較的 20 ェイス(図示せず)とTVカメラ10によって撮像され た画像を格納するための画像メモリ(図示せず)とを有 し、画像間の積算、加減算の機能をもつ。

【0016】次に、図1に示した3次元物体形状測定装 置の動作について説明する。光源1から出射された光 は、コリメーティングレンズ2でコリメートされた後、  $2次元スキャナ3によって<math>2次元的に走査され、<math>f \cdot \theta$ レンズ4によって物体5上に縞模様のバタンを猫画す る。物体5の面上にできた縞模様のバタンは、TVカメ ラ1()によって観測され、画像処理装置11に転送され 目の測定の締の方向から90° 異なる方向の縞を物体に 30 る。画像処理装置11には、あらかじめ濱算制御装置9 により、それぞれの縞模様に対応する基準の縞状パタン が入力されており、物体面で変形した縞模様との間のモ アレ縞を抽出する。このモアレ縞を演算制御装置9によ って解析することによって、物体5の表面の等高線を求 めることができる。

> 【①①17】本発明は上述した実施形態に限定せず、本 発明の趣旨を退脱しない範囲内で積々の変更・変形が可 能である。

#### [0018]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、光源から 出射した光ビームを定査する定査手段として、例えばガ ルバノミラーからなる2次元スキャナを用いているの で 光ビームを2次元的に自由に定査することができ る。すなわち、2次元スキャナを用いて光ビームを定査 することによって、物体上に任意のピッチと方向とをも った縞模様のバタンを発生(描画)させることができ る。また、走査手段が2次元スキャナなので、1次元ス キャナよりも構成が簡易となる。さらに、方向とピッチ の異なる縞模様のパタンを少なくとも2回、物体上に描 (4) 特別平10-197225

体においても、容易に3次元形状を計測することが可能 となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係わる3次元物体形状 計測鉄置の構成を示すプロック図である。

【図2】階段状物体における計測の不可能な格子の方向 例を示す図である。

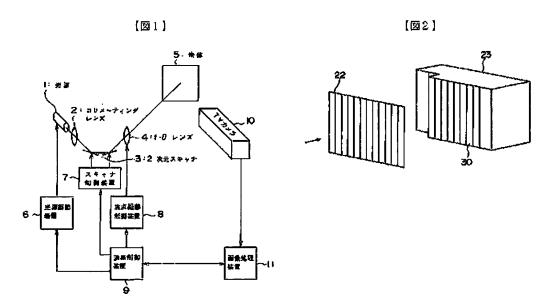
【図3】階段状物体における計測の可能な格子の方向例を示す図である。

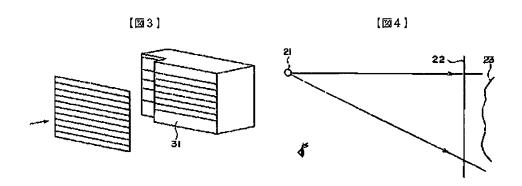
【図4】従来の格子照射型モアレトポグラフィを示す図 19 である。

【図5】従来の格子投影型モアレトボグラフィを示す図である。

\*【符号の説明】

- 1 光源
- 2 コリメーティングレンズ
- 3 2次元スキャケ
- 4 ・8 ・8 レンズ
- 5 物体
- 6 光源駆動装置
- 7 スキャナ制御装置
- 8 焦点距離副御装置
- 9 演算制御装置
- 10 TVカメラ
- 11 画像処理装置





(5)

特関平10-197225

[図5]

